A theoretically accurate mobility model for semiconductor device drift-diffusion simulation
Velmre, Enn; **Udal, Andres**; Kocsis, T.; Masszi, F. Physica scripta 1994 / p. 263-267 https://doi.org//10.1088/0031-8949/1994/T54/064

Ab inito study of GaN properties using VASP software package
Klopov, Mihhail; Kuusk, Ahto; **Velmre, Enn**; **Udal, Andres** BEC 2004 : proceedings of the 9th Biennial Baltic Electronics Conference : October 3-6, 2004, Tallinn, Estonia 2004 / p. 55-58 : ill

Advances in terahertz technology with emphasis on quantum cascade lasers
Reeder, Reeno; **Velmre, Enn**; **Udal, Andres** Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and electrical engineering 2010 / p. 47-50 : ill https://eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/9225

Ambipolar diffusion in a three-carrier semiconductor plasma
Velmre, Enn; Masszi, F. Program of 17th Nordic Semiconductor Meeting, Trondheim, Norwey, June 17-20, 1996 1996 / p. 36

Apparent decrease of diffusion coefficients due to the plasma-induced band gap narrowing
Udal, Andres; **Velmre, Enn** 19th Nordic Semiconductor Meeting : May 20-23, 2001, Copenhagen, Denmark : abstracts 2001 / p. 22 : ill

A brief survey of exciton concentration models for Si
Velmre, Enn; **Udal, Andres** The 7th Biennial Conference on Electronics and Microsystem Technology "Baltic Electronics Conference" : BEC 2000 : October 8 - 11, 2000, Tallinn, Estonia : conference proceedings 2000 / p. 19-22 : ill

[Christou, A. Integrating reliability into microelectronics manufacturing. Series on design and measurement in electronic engineering, edited by D.V.Morgan and H.L.Grubin. Wiley, Chichester, 1994. 349 p. : Book review]
Velmre, Enn Engineering applications of artificial intelligence 1996 / p. 97 https://www.ester.ee/record=b1200126*est

Comparison of methods for solving the Schrödinger equation for multiquantum well heterostructure applications
Udal, Andres; **Reeder, Reeno**; **Velmre, Enn**; Harrison, Paul Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Engineering = Eesti Teaduste Akadeemia toimetised. Tehnikateadused 2006 / p. 246-261 : ill https://www.ester.ee/record=b1072102*est

Comparison of photon recycling effect in GaAs and GaN structures
Velmre, Enn; **Udal, Andres** Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Engineering = Eesti Teaduste Akadeemia toimetised. Tehnikateadused 2004 / p. 157-172 : ill https://www.ester.ee/record=b1072102*est

Comparison of Si and SiC devices surge current capability by means of numerical simulations
Velmre, Enn; **Udal, Andres** BEC'96 : the 5th Biennial Baltic Electronics Conference, October 7-11, 1996, Tallinn, Estonia : proceedings 1996 / p. 77-80: ill

Comparison of uncertainty relations in quantum mechanics and signal processing
Udal, Andres; **Kukk, Vello**; **Velmre, Enn**; **Klopov, Mihhail** 11th International Conference on Squeezed States and Uncertainty Relations and 4th Feynman Festival : June 22-26, 2009, Olomouc, Czech Republic : book of abstracts 2009 / p. 135-136 https://jointlab.upol.cz/icssur2009/doc/bookabs_2nded.pdf

Comparison of uncertainty relations in quantum mechanics and signal processing [Electronic resource]
Udal, Andres; **Kukk, Vello**; **Velmre, Enn**; **Klopov, Mihhail** 11th International Conference on Squeezed States and Uncertainty Relations and 4th Feynman Festival : Olomouc, Czech Republic, June 22-26, 2009 : conference proceedings 2009 / [16] p. [DVD]

Computer-aided analysis of the GTO thyristor current squeezing effect
Velmre, Enn; **Udal, Andres** Automation, simulation & measurement : 3rd biennal conference : Tallinn, Estonia, October 7-11, 1991. Section S, Simulation = Automatiseerimine, modelleerimine ja mõõtmine : 3. rahvusvaheline konverents / Tallinna Tehnikaülikool 1992 / p. 159-171: ill https://www.ester.ee/record=b1064031*est

Corrected accounting of electron-hole scattering in cross-term current equations for Si and SiC
Velmre, Enn; **Udal, Andres** Physica scripta 1999 / p. 193-197 : ill https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1999PhST...79..193V/abstract http://doi.org/10.1238/Physica.Topical.079a00193

Corrected accounting of electron-hole scattering in cross-term current equations for Si and SiC
Velmre, Enn; **Udal, Andres** 18th Nordic Semiconductor Meeting, Linköping, June 7-10, 1998 : abstracts 1998 / p. F-88: ill https://iopscience.iop.org/article/10.1238/Physica.Topical.079a00193

Critical analysis of uncertainty relations based on signal duration and spectrum width
Udal, Andres; **Kukk, Vello**; **Velmre, Enn** Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and electrical engineering 2009 / p. 31-34 : ill https://www.ester.ee/record=b1200105*est https://eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/10098

Development and optimisation of modelling methods and algorithms for terahertz range radiation sources based on

quantum well heterostructures = Kvantaukudega heterostruktuuridel põhinevate terahertskiirgurite modelleerimismeetodite ja -algoritmide arendus ja optimeerimine
Reeder, Reeno 2014 https://www.ester.ee/record=b3084247*est

Development of numerical semiconductor device models and their application in device theory and design
Udal, Andres 1998 http://www.ester.ee/record=b1158907*est

Development of quantum cascade laser simulation software
Udal, Andres; **Reeder, Reeno**; Ikonic, Zoran; Harrison, Paul; **Velmre, Enn** BEC 2012 : 2012 13th Biennial Baltic Electronics Conference : proceedings of the 13th Biennial Baltic Electronics Conference : October 3-5, 2012, Tallinn, Estonia 2012 / p. 47-48 : ill https://www.ester.ee/record=b2150914*est

Discussion of the development aspects of the quantum cascadelaser simulation software
Reeder, Reeno; **Udal, Andres**; **Velmre, Enn** International Conference on THz and Mid Infrared Radiation and Applications to Cancer Detection Using Laser Imaging jointly with the Workgroup Meetings of Cost Actions MP1204 and BM1205 : October 10-11, 2013, Sheffiled, United Kingdom 2013 / p. [36] http://tera-mir.org/main/node/60

Eesti kingitus maailma füüsikale : 9. aprillil möödus 237 aastat Thomas Johann Seebecki sünnist Tallinnas : [intervjuu prof. Enn Velmre ja prof. Mart Min'iga]
Velmre, Enn; **Min, Mart** Mente et Manu 2007 / 18. apr., lk. 3 : ill https://www.ester.ee/record=b1242496*est

Efficiency estimation for a broadband 7 THz radiation source with GaAs/AlGaAs parabolic quantum wells
Reeder, Reeno; Ikonic, Zoran; Harrison, Paul; **Udal, Andres**; **Velmre, Enn** The proceedings of the Ninth International Conference on Intersubband Transitions in Quantum Wells : Ambleside, Cumbria, U.K., 9-14th September 2007 2007 / p. P67-2 : ill https://www.academia.edu/63544688/Efficiency_Estimation_for_a_Broadband_7_THz_Radiation_Source_with_GaAs_AlGaAs_Parabolic_Quantum_Wells

Electrothermal simulation of power semiconductor devices
Freidin, Boris; **Velmre, Enn**; **Udal, Andres** Proceedings of the 1991 International Workshop on VLSI Process and Device Modeling, 26-27 May, 1991, Oiso, Kanagawa, Japan 1991 / p. 28-29

Electro-thermal simulations and forward surge current failure prediction for SiC diodes
Velmre, Enn; **Udal, Andres** Program of 17th Nordic Semiconductor Meeting, Trondheim, Norwey, June 17-20, 1996 1996 / p. 28

Elektronmäng
Velmre, Enn ENEKE. 4. [köide], Suurk-Y. Sisujuht. Lisa : õpilase teatmeteos 1986 / lk. 240-241 https://www.ester.ee/record=b1244551*est

Elektrontehnika füüsikalised alused : laboratoorsete tööde juhendid ja harjutusülesanded
1981 https://www.ester.ee/record=b1317817*est

Elektroonika
Velmre, Enn TEA entsüklopeedia. 6. köide, eerika - faiaagid 2011 / lk. 199

Elektroonika desintegratsioon
Velmre, Enn Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 2002 2003 / lk. 33-38 https://www.ester.ee/record=b1212786*est

The experimental results of reverse recovery effects in power fastrecovery diodes analyzed by numerical model
Velmre, Enn; **Udal, Andres**; Vaher, G.T.; **Tarma, Mati** Proceedings International AEGEAN Conference on Electrical Machines and Power Electronics, Kusadasi 27-29 May, 1992 1992 / p. 738-743: fig

Failure prediction of power devices under reverse surge current conditions
Freidin, Boris; **Velmre, Enn**; **Udal, Andres** ISPSD'92 : Proceedings of the 4th International Symposium on Power Semiconductor Devices & Ics, Waseda University, Tokyo, Japan, 19-21 May 1992 1992 / p. 118-123 : ill https://doi.org//10.1109/ISPSD.1992.991247

Filter
Velmre, Enn TEA entsüklopeedia. 7. köide, Faial - Haamer 2011 / lk. 61-62 https://www.ester.ee/record=b2712813*est

40 years of Electronics Department at Tallinn Technical University
Tamm, Uljas; **Velmre, Enn** BEC 2002 : proceedings of the 8th Biennial Baltic Electronics Conference : October 6-9, 2002, Tallinn, Estonia 2002 / p. 7-10 https://www.ester.ee/record=b2150914*est

GIGA - power semiconductor devices simulation software
Freidin, Boris; **Velmre, Enn**; **Udal, Andres** The Bug Exterminator (USA). Special issue, Santa Clara 1990 / p. 1-16: fig

High phonon-drag thermoelectric efficiency of SiC at low temperatures

Velmre, Enn; **Udal, Andres**; Grivickas, Vytautas Final program of the 10th International Conference on SiC and Related Materials : ICSCRM'2003 : Lyon, France, Oct. 5-10, 2003 2003 / p. ThP4-13 https://www.researchgate.net/publication/240834700_High_Phonon-Drag_Thermoelectric_Efficiency_of_SiC_at_Low_Temperatures

Impact of phonon drag effect on Seebeck coefficient in p-6H-SiC : experiment and simulation
Bikbajevas, V.; Grivickas, Vytautas; Stölzer, M.; **Velmre, Enn**; **Udal, Andres**; Grivickas, Paulius; Syväjärvi, Mikael; Yakimova, Rositza Materials science forum 2003 / p. 407-410 https://www.scientific.net/MSF.433-436.407 https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.433-436.407

Impact of phonon-drag effect on Seebeck coefficient in SiC : experiment and simulation
Bikbajevas, V.; Grivickas, V.; Stölzer, M.; **Velmre, Enn**; **Udal, Andres**; Grivickas, Paulius; Syväjärvi, Mikael; Yakimova, Rositza Abstracts of the Lithuanian National Physics Conference : LNPK-34 : Vilnius, 2003 2003 / p. 219 http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A269444&dswid=8596

Influence of excitonic scattering on charge carrier ambipolar diffusion in silicon
Udal, Andres; **Velmre, Enn** ESSDERC'97 : proceedings of the 27th European Solid-State Device Research Conference, Stuttgart, Germany, 22-24 September 1997 1997 / p. 212-215: ill https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=1503333

Infotehnoloogia teaduskond
Gordon, Boris; **Velmre, Enn**; **Einer, Lauri**; **Tamm, Uljas**; **Meister, Ants**; **Korsen, Viljo**; **Märtens, Olev**; **Parve, Toomas**; **Ubar, Raimund-Johannes**; **Min, Mart** Leiutajaid ja leiutisi Tallinna Tehnikaülikoolis 1922-2007 2008 / lk. 34-47 : ill https://www.ester.ee/record=b2412718*est

Integraallülitus
Velmre, Enn TEA entsüklopeedia. 9. köide, indeen - Kallak 2012 / lk. 59-60 https://www.ester.ee/record=b2869027*est

Investigation of charge carrier lifetime temperature-dependence in 4H-SiC diodes
Velmre, Enn; **Udal, Andres** Silicon carbide and related materials 2006 2007 / p. 375-378 https://www.researchgate.net/publication/250348987_Investigation_of_Charge_Carrier_Lifetime_Temperature-Dependence_in_4H-SiC_Diodes

Investigation of silicon carbide diode structures via numerical simulations including anisotropic effects
Velmre, Enn; **Udal, Andres**; Masszi, F.; Nordlander, E. Simulation of semiconductor devices and processes. Vol. 6 1995 / p. 340-343: ill https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-7091-6619-2_83

Ioonseadis
Velmre, Enn TEA entsüklopeedia. 9. köide, indeen - Kallak 2012 / lk. 73 https://www.ester.ee/record=b2869027*est

Jaapani professor esines Tallinna Tehnikaülikoolis : [Tohoku Ülikooli prorektor ja biomeditsiinielektroonika labori juhataja Nozomu Hoshimiya]
Min, Mart; **Velmre, Enn** Mente et Manu 2001 / lk. 3 : portr https://www.ester.ee/record=b1242496*est

Jõupooljuhtseadiste numbrilise modelleerimise alased tööd TPI-s
Velmre, Enn Kõrgema tehnilise hariduse ja tehnilise mõtte areng Eestis 1988 / lk. 128-143

Jõupooljuhtseadiste numbriliste mudelite väljatöötamine ja rakendamine : ainevaldkond : elektrotehnika : magistritöö
Udal, Andres 1992 http://www.ester.ee/record=b2630327*est

Kui vana on elektroonika?
Velmre, Enn Elektroonika 2004 : XI rahvusvahelise telekommunikatsioonipäeva materjalid 2004 / lk. 53-56 https://www.ester.ee/record=b1910557*est

Kui vana on elektroonika? : ettekanne rahvusvahelise telekommunikatsioonipäeva konverentsil "Elektroonika 2004" 14. mail 2004 TTÜs
Velmre, Enn Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 2004 2005 / lk. 291-296 : ill https://www.ester.ee/record=b1212786*est

Kuulsa füüsiku mälestusmärk TTÜ linnakus : [Thomas Johann Seebecki mälestusmärgi avamine 24. mail 2013]
Velmre, Enn Mente et Manu 2013 / lk. 18 : fot https://www.ester.ee/record=b1242496*est

Kõrgema tehnilise hariduse ja tehnilise mõtte areng Eestis
Kulbach, Valdek; **Hinrikus, Hiie**; **Järvik, Jaan**; **Kanasaar, Eduard**; **Kilk, Aleksander**; **Metusala, Tiit**; **Mägi, Vahur**; **Tamm, Uljas**; **Tapupere, Olev**; **Tiismus, Hugo**; **Ubar, Raimund-Johannes**; **Velmre, Enn** 1988 https://www.ester.ee/record=b1243393*est

Lambid, transistorid või ...?
Velmre, Enn Tallinna Polütehnik 1972 / lk. 3 https://www.ester.ee/record=b1254708*est

Laterally pumped GaAs/AlGaAs quantum wells as sources of broadband terahertz radiation

Reeder, Reeno; Ikonic, Zoran; Harrison, Paul; **Udal, Andres**; **Velmre, Enn** Journal of applied physics 2007 / [6] p. : ill https://pubs.aip.org/aip/jap/article/102/7/073715/987937/Laterally-pumped-GaAs-AlGaAs-quantum-wells-as https://doi.org/10.1063/1.2783779

Measurement of charge carrier lifetime temperature dependence in 4H-SiC power diodes
Velmre, Enn; **Udal, Andres** Abstracts of International Conference on Silicon Carbide and Related Materials : ICSCRM'99 : October 10-15, 1999, Research Triangle Park, North-Carolina, USA 1999 / paper no 394, 2 p https://www.researchgate.net/publication/240833834_Measurement_of_Charge_Carrier_Lifetime_Temperature-Dependence_in_4H-SiC_Power_Diodes

Measurement of charge carrier lifetime temperature-dependence in 4H-SiC power diodes
Udal, Andres; **Velmre, Enn** Proceedings of the International Conference on Silicon Carbide and Related Materials - 1999 (ICSCRM'99) : Research Triangle Park, North-Carolina, USA, Oct. 10-15, 1999. Vol. 1 2000 / p. 781-784 https://www.scientific.net/MSF.338-342.781

Modeling and simulation of bipolar semiconductor devices : authors's main publications
Velmre, Enn 1996 http://www.ester.ee/record=b2079366*est

Modeling in semiconductor electronics
Velmre, Enn; **Rang, Toomas** BEC : Baltic Electronics Conference : proceedings of the 4th Biennial Conference, October 9-14, 1994, Tallinn (Estonia). 2 1994 / p. 501-516: ill https://www.ester.ee/record=b2150914*est

Modeling in semiconductor electronics
Javor, A.; **Rang, Toomas**; Szekely, V.; Tarnay, K.; **Velmre, Enn** 1993 https://www.ester.ee/record=b1031052*est

Modeling of a carbon nanotube junction with ab-inito software VASP
Velmre, Enn; **Klopov, Mihhail**; **Udal, Andres** BEC 2008 : 2008 International Biennial Baltic Electronics Conference : proceedings of the 11th Biennial Baltic Electronics Conference : Tallinn University of Technology : October 6-8, 2008, Tallinn, Estonia 2008 / p. 75-78 : ill

Modeling of charge carrier non-isothermal transport parameters in silicon
Velmre, Enn; **Udal, Andres** BEC'98 : the 6th Biennial Conference on Electronics and Microsystems Technology, October 7-9, 1998, Tallinn, Estonia : proceedings 1998 / p. 71-74: ill

Modeling of lattice heat conductivity and thermopower in SiC considering the four-phonon scattering processes
Velmre, Enn; **Udal, Andres** Material science forum 2003 / p. 391-394 https://www.scientific.net/MSF.433-436.391

Modeling of photon recycling in GaN-devices
Velmre, Enn; **Udal, Andres**; **Klopov, Mihhail** Material Science Forum. 483/485 2005 / p. 1039-1042 https://www.researchgate.net/publication/250344144_Modeling_of_Photon_Recycling_in_GaN-Devices

Modeling of photon recycling in GaN-devices
Velmre, Enn; **Udal, Andres**; **Klopov, Mihhail** 5th European Conference on Silicon Carbide and Related Materials : book of abstracts : 31 August-4 September 2004, Bologna, Italy 2004 / p. 317-318 https://www.researchgate.net/publication/250344144_Modeling_of_Photon_Recycling_in_GaN-Devices

Modeling of photon recycling in GaN-devices
Velmre, Enn; **Udal, Andres**; **Klopov, Mihhail** Silicon carbide and related materials 2004 : ECSCRM 2004 : proceedings of the 5th European Conference on Silicon Carbide and Related Materials, August 31-September 4, 2004, Bologna, Italy 2005 / p. 1039-1042 : ill https://www.researchgate.net/publication/250344144_Modeling_of_Photon_Recycling_in_GaN-Devices

Modelling of charge carrier non-isothermal transport in silicon and silicon carbide
Velmre, Enn; **Udal, Andres** Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Engineering 2000 / p. 144-154 : ill https://artiklid.elnet.ee/record=b1004044*est

Nanotehnoloogiad : sõnastik. Osa 1, Tuumik-sõnavara = Nanotechnologies : vocabulary. Part 1, Core terms
2011 https://www.ester.ee/record=b2707940*est

Nanotehnoloogiad : sõnastik. Osa 3, Süsinik-nanoobjektid = Nanotechnologies : vocabulary. Part 3, Carbon nano-objects
2011 https://www.ester.ee/record=b2707947*est

Nanotehnoloogiad [Võrguteavik] : sõnastik. Osa 1, Tuumik-sõnavara = Nanotechnologies : vocabulary. Part 1, Core terms (ISO/TS 80004-1:2015)
2016 http://www.ester.ee/record=b4601747*est

Nanotehnoloogiad [Võrguteavik] : sõnastik. Osa 2, Nanoobjektid = Nanotechnologies : vocabulary. Part 2, Nano-objects

(ISO/TS 80004-2:2015)
2017 https://www.ester.ee/record=b4697338*est

Nanotehnoloogiad [Võrguteavik] : sõnastik. Osa 3, Süsinik-nanoobjektid = Nanotechnologies : vocabulary. Part 3, Carbon nano-objects (ISO/TS 80004-3:2010)
2015 http://www.ester.ee/record=b4454176*est

Nanotehnoloogiad [Võrguteavik] : sõnastik. Osa 4, Nanostruktuur-materjalid = Nanotechnologies : vocabulary. Part 4, Nanostructured materials (ISO/TS 80004-4:2011)
2015 http://www.ester.ee/record=b4454176*est

Nanotehnoloogiad [Võrguteavik] : sõnastik. Osa 4, Nanostruktuur-materjalid = Nanotechnologies : vocabulary. Part 4, Nanostructured materials (ISO/TS 80004-4:2011)
2013 https://www.ester.ee/record=b4459478*est

Nanotehnoloogiad [Võrguteavik] : sõnastik. Osa 6, Nanoobjektide karakteriseerimine = Nanotechnologies : vocabulary. Part 6, Nano-object characterization (ISO/TS 80004-6:2013)
2015 http://www.ester.ee/record=b4457416*est

Nanotehnoloogiad [Võrguteavik] : sõnastik. Osa 6, Nanoobjektide karakteriseerimine = Nanotechnologies : vocabulary. Part 6, Nano-object characterization (ISO/TS 80004-6:2013)
2015 http://www.ester.ee/record=b4483533*est

Nanotehnoloogiad [Võrguteavik] : sõnastik. Osa 8, Nanotootmisprotsessid = Nanotechnologies : vocabulary. Part 8, Nanomanufacturing processes (ISO/TS 80004-8:2013)
2015 http://www.ester.ee/record=b4531230*est

Nanotehnoloogiad [Võrguteavik] : sõnastik. Osa 1, Tuumik-sõnavara = Nanotechnologies : vocabulary. Part 1, Core terms (ISO/TS 80004-1:2010)
2015 http://www.ester.ee/record=b4454097*est

Nanotehnoloogiat meilt ja mujalt
Velmre, Enn Elektriala 2005 / lk. 22-24 : ill

Nonisothermal numerical simulation of semiconductor power devices
Velmre, Enn; **Udal, Andres** Automation, simulation & measurement : 3rd biennal conference : Tallinn, Estonia, October 7-11, 1991. Section S, Simulation = Automatiseerimine, modelleerimine ja mõõtmine : 3. rahvusvaheline konverents / Tallinna Tehnikaülikool 1992 / p. 139-145: ill https://www.ester.ee/record=b1064031*est

Numerical analysis of forward-biased diode structures based on direct-gap semiconductors
Velmre, Enn; **Freidin, Boris** Electronics letters : an international publication 1979 / p. 383-385
https://www.ester.ee/record=b2180432*est

Numerical analysis of the on-state of diode structures based on direct-gap semiconductors
Velmre, Enn; **Freidin, Boris**; **Udal, Andres** Physica scripta : an international journal for experimental and theoretical physics 1981 / p. 468-471 : ill https://www.ester.ee/record=b2244094*est https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0031-8949/24/2/026/pdf

Numerical aspects of the development of quantum cascade laser simulation software
Reeder, Reeno; **Udal, Andres**; **Velmre, Enn**; Valavanis, Alexander BEC 2014 : 2014 14th Biennial Baltic Electronics Conference : proceedings of the 14th Biennial Baltic Electronics Conference : Tallinn University of Technology, October 6-8, 2014, Tallinn, Estonia 2014 / p. 37-40 : ill

Numerical investigation of digitised parabolic quantum wells for terahertz AlGaAs/GaAs structures
Reeder, Reeno; **Udal, Andres**; **Velmre, Enn**; Harrison, Paul BEC 2006 : 2006 International Baltic Electronics Conference : Tallinn University of Technology, October 2-4, 2006, Tallinn, Estonia : proceedings of the 10th Biennial Baltic Electronics Conference 2006 / p. 51-54 : ill

Numerical investigation of SiC devices performance considering the incomplecte dopant ionization
Velmre, Enn; **Udal, Andres** Silicon carbide and related materials 2005 2006 / p. 1383-1386 https://www.scientific.net/MSF.527-529.1383

Numerical modeling of the electrothermal transient process in diode structures based on direct-cap-semiconductors
Velmre, Enn; **Freidin, Boris** Physica status solidi. A, Applied research 1983 / p. K131-K134 https://www.ester.ee/record=b1562026*est

Numerical simulation of a forward-based p-i-n structure with band-to-band Auger recombination
Freidin, Boris; **Velmre, Enn** Electronics letters : an international publication 1978 / p. 701-703

https://www.ester.ee/record=b2180432*est

Numerical simulation of a silicon carbide diode
Velmre, Enn; **Udal, Andres** BEC : Baltic Electronics Conference : proceedings of the 4th Biennial Conference, October 9-14, 1994, Tallinn (Estonia). 2 1994 / p. 559-566: ill https://www.ester.ee/record=b2150914*est

Numerical simulation of electrothermal effects in ESD protection devices
Hellstrom, S.; **Freidin, Boris**; **Velmre, Enn**; **Udal, Andres** Techn. Dig. of the 3rd European Symposium on Reliability of Electron Devices, Failure Physics and Analysis, 1992, Oct. 5-8, Schwäbisch Gmünd, Germany 1992 / p. 77-80 https://d-nb.info/921228503/04

Numerical simulation of electrothermal interactions in semiconductor devices experiencing ESD pulses
Freidin, Boris; **Velmre, Enn**; **Udal, Andres** Techn. Dig. of International Workshop on Computational Electronics, 1992 May 28-29, Beckman Institute, Univ. of Illinois Urbana-Champaign, USA 1992 / p. 75-78 : ill
https://in4.iue.tuwien.ac.at/pdfs/iwce/iwce1_1992/pdfs/pp075-078.pdf

Pooljuhid läbi aegade
Velmre, Enn Horisont 1974 / lk. 15-19 : ill.; 7 lk. 26-28 : ill.; 9 lk. 24-27 https://www.digar.ee/arhiiv/et/perioodika/69737 https://www.digar.ee/arhiiv/et/perioodika/69744 https://www.ester.ee/record=b1072243*est https://www.digar.ee/arhiiv/et/perioodika/69745

Pooljuhtseadis
Velmre, Enn ENEKE, 3. [kd.], Mol - Suurj. : õpilase teatmeteos 1984 / lk. 147 : ill https://www.ester.ee/record=b1339899*est

Power diode transient characteristics modeling in inductive load circuits
Freidin, Boris; **Velmre, Enn**; **Udal, Andres** The Bug Exterminator (USA) 1991 / p. 1-5: fig

Quantum mechanical transforms between x- and k-space as a signal processing problem
Udal, Andres; **Kukk, Vello**; **Velmre, Enn**; **Klopov, Mihhail** BEC 2008 : 2008 International Biennial Baltic Electronics Conference : proceedings of the 11th Biennial Baltic Electronics Conference : Tallinn University of Technology : October 6-8, 2008, Tallinn, Estonia 2008 / p. 71-74 : ill https://www.ester.ee/record=b2150914*est

Raamatu tekkeloost : [Velmre, E. ; (toim.) Kello, K. Tallinna kaupmehepojast füüsikaklassikuks : Thomas Johann Seebeck 1770-1831. Tallinn : Argo, 2022]
Velmre, Enn Elektriala 2022 / lk. 27 : portr https://www.ester.ee/record=b1240496*est

Saateks
Velmre, Enn Tallinna kaupmehepojast füüsikaklassikuks : Thomas Johann Seebeck 1770-1831 2022 / lk. 13-17
https://www.ester.ee/record=b5519213*est

SiC-diodes forward surge current failure mechanisms : experiment and simulation
Udal, Andres; **Velmre, Enn** Microelectronics reliability 1997 / p. 1671-1674 https://doi.org/10.1016/S0026-2714(97)00136-4

SiC-diodes forward surge current failure mechanisms : experiment and simulation
Velmre, Enn; **Udal, Andres** ESREF'97 : proceedings of the 8th European Symposium on Reliability of Electron Devices, Failure Physics and Analysis, Oct. 7-10, 1997, Bordeaux, France 1997 / p. 1671-1674
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0026271497001364

Study of radiative recombination influence in GaN and GaAs bipolar transistor structures
Velmre, Enn; **Udal, Andres**; Verbitski, Irina BEC 2004 : proceedings of the 9th Biennial Baltic Electronics Conference : October 3-6, 2004, Tallinn, Estonia 2004 / p. 59-62 : ill

Tallinna kaupmehe pojast füüsikaklassikuks. Thomas Johann Seebeck (1770-1831)
Velmre, Enn Vana Tallinn. XXIII (XXVII) 2012 / lk. 274-286 : ill https://artiklid.elnet.ee/record=b2538155*est

Tallinna kaupmehepojast füüsikaklassikuks : Thomas Johann Seebeck 1770-1831
Velmre, Enn 2022 https://www.ester.ee/record=b5519213*est

TEA entsüklopeedia
2012 https://www.ester.ee/record=b2869027*est

TEA entsüklopeedia
2011 https://www.ester.ee/record=b2666688*est

TEA entsüklopeedia
2011 https://www.ester.ee/record=b2712813*est

Termoelektri avastaja Thomas Johann Seebeck : [ettekanne rahvusvahelisel seminaril 11. mail 2007 TTÜs]
Velmre, Enn Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 2007 2008 / lk. 335-339

A theoretical study of electron drift mobility anisotropy in n-type 4H- and 6H-SiC
Velmre, Enn; **Udal, Andres** Materials science forum 2000 / p. 725-728

A theoretical study of electron drift mobility anisotropy in n-type 4H- and 6H-SiC
Velmre, Enn; **Udal, Andres** Abstracts of International Conference on Silicon Carbide and Related Materials : ICSCRM'99 : October 10-15, 1999, Research Triangle Park, North-Carolina, USA 1999 / paper no 395, 2 p
https://www.researchgate.net/publication/250338907_A_Theoretical_Study_of_Electron_Drift_Mobility_Anisotropy_in_n-Type_4H-and_6H-SiC

A theoretically accurate mobility model for drift-diffusion power device simulation
Velmre, Enn; **Udal, Andres**; Kocsis, T.; Masszi, F. 16th Nordic Semiconductor Meeting, Laugarvatn, Iceland, June 12-15, 1994 : abstracts 1994 / p. 92

Thermopower measurements in 4H-SiC and Theoretical calculations considering the phonon drag effect
Grivickas, V.; Stölzer, M.; **Velmre, Enn**; **Udal, Andres**; Grivickas, P.; Syväjärvi, M.; Yakimova, R.; Bikbajevas, V. Abstracts of the 3rd European Conference on Silicon Carbide and Related Materials : ECSCRM'2000 : Sept. 3-7, 2000, Kloster Banz, Germany 2000 / p. 144

Thermopower measurements in 4H-SiC and theoretical calculations considering the phonon drag effect
Grivickas, Vytautas; Stölzer, M.; **Velmre, Enn**; **Udal, Andres**; Grivickas, Paulius; Syväjärvi, Mikael; Yakimova, Rositza; Bikbajevas, V. Silicon Carbide and Related Materials : ECSCRM2000 : proceedings of the 3rd European Conference on Silicon Carbide and Related Materials : Kloster Banz, Germany, September 2000 2001 / p. 491-494 : ill
https://www.researchgate.net/publication/240833914_Thermopower_Measurements_in_4H-SiC_and_Theoretical_Calculations_Considering_the_Phonon_Drag_Effect

Thomas J. Seebeck 250 : tänased mikro- ja nanoelektroonika lahendused toetuvad tuntumaile Eestis sündinud täppisteadlasele
Härmat, Karin Mente et Manu 2020 / lk. 64-65 : ill https://www.ttu.ee/public/m/mente-et-manu/MM_01_2020/mobile/index.html
https://www.ester.ee/record=b1242496*est

Thomas J. Seebeck 250 : tänased mikro- ja nanoelektroonika lahendused toetuvad tuntumaile Eestis sündinud täppisteadlasele
Härmat, Karin Elektriala 2020 / lk. 24-25 http://www.ester.ee/record=b1240496*est

Thomas Johann Seebeck (1770-1831)
2007 http://www.ester.ee/record=b2285820*est

Thomas Johann Seebeck (1770-1831)
Velmre, Enn Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Engineering 2007 / 4, p. 276-282

Thomas Johann Seebeck and his contribution to the modern science and technology
Velmre, Enn BEC 2010 : 2010 12th Biennial Baltic Electronics Conference : proceedings of the 12th Biennial Baltic Electronics Conference : Tallinn University of Technology, October 4-6, 2010, Tallinn, Estonia 2010 / p. 17-24 : ill

Thomas Johann Seebeck ja tema panus tänapäeva teadusesse ja tehnikasse
Velmre, Enn Elektriala 2019 / lk. 28-29 : ill; 4, lk. 28-29 : ill; 5, lk. 26-27 : fot http://www.ester.ee/record=b1240496*est

Tunne kolleegi. Enn Velmre : [intervjuu Enn Velmrega]
Velmre, Enn; **Rang, Toomas**; **Haldre, Eero**; **Oras, Anne**; **Min, Mart** Avaja 2003 / lk. 3 : fot

Two-dimensional surge current modeling of packaged power devices
Udal, Andres; **Freidin, Boris**; **Velmre, Enn** The Bug Exterminator : a monthly publication of Silvaco International 1992 / p. 6-7

Tööstuselektroonika eriala üliõpilaste ankeetvaatluse tulemustest
Velmre, Enn Õppemetoodika küsimusi ; 13 1976 / lk. 72-74 https://www.ester.ee/record=b1346720*est

Uncovering some hidden pages in the life of Thomas Johann Seebeck
Velmre, Enn Journal of thermoelectricity 2015 / p. 5-9 http://jt-old.ite.cv.ua/jt/jt_2015_04_en.pdf

Uuringuid jõupooljuhtelektroonika seadiste ja seadmete alalt
Velmre, Enn Tehnikauuringute areng Eesti NSV-s : vabariikliku konverentsi ettekannete teesid : Tallinn, 15.-16. oktoober 1986 1986 / lk. 129-132 https://www.ester.ee/record=b1258828*est

Velmre, Enn : engineering educator

Velmre, Enn Who's Who In The World 2007. 24th Edition 2006 / p. 2636
https://archive.org/details/whoswhoinworld200000marq_24ed/page/n5/mode/2up

Аналитико-численная модель для исследования стационарного непроводящего состояния силовых тиристоров
Velmre, Enn; **Rang, Toomas** Расчет и проектирование измерительных преобразователей 1983 / с. 57-67 : ил
https://www.ester.ee/record=b1288985*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/4e3815a3-f217-4ae2-9776-1b5ea3c25959

Влияние распределения примеси на прямую ВАХ арсенидгаллиевых силовых диодных структур
Velmre, Enn; **Freidin, Boris** Полупроводниковые приборы : сборник статей 1982 / с. 32-37 : ил
https://www.ester.ee/record=b1356516*est

Гармоническая линеаризация широтно-импульсного модулятора второго рода
Velmre, Enn Труды по электротехнике и автоматике : сборник статей. 11 1973 / с. 135-143 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190624*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d6e57925-e104-44e1-a218-c5b3110d9996

Зависимость подвижности электронов и дырок от температуры и концентрации примеси в кремнии
Rang, Toomas; **Velmre, Enn** Анализ и моделирование технических устройств и систем АСУТП 1977 / с. 115-120 : ил
https://www.ester.ee/record=b2190987*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b7c66054-0b4f-4684-9453-442bc7e6e200

Измерение коэффициентов ударной ионизации в pn-переходах при очень низкой интенсивности размножения
Velmre, Enn; **Pikkov, Mihhail** Машинное проектирование электронных устройств и систем 1989 / с. 3-19 : ил

Использование четырехзондового метода для измерения различных параметров полупроводникового материала
Samolevski, B.; **Korpen, J.**; **Velmre, Enn** XX студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик, Белорусской ССР и Молдавской ССР : тезисы докладов. Часть 1 1974 / с. 117 https://www.ester.ee/record=b1306141*est

Исследование лавинного пробоя p-n перехода
Rang, Toomas; **Velmre, Enn** XX студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик, Белорусской ССР и Молдавской ССР : тезисы докладов. Часть 1 1974 / с. 118 https://www.ester.ee/record=b1306141*est

Исследование процесса переключения диодных структур низковольтных диодов с эпитаксиальной базовой областью
Vaher, G.; **Velmre, Enn**; Lumi, J.; **Tarma, Mati**; **Udal, Andres** Полупроводниковые приборы : сборник статей 1982 / с. 13-17 : ил
https://www.ester.ee/record=b1356516*est

Исследование прямой ВАХ мощных диодов с узкой базовой областью
Vaher, G.; **Velmre, Enn**; **Tarma, Mati** Полупроводниковые приборы : сборник статей 1982 / с. 9-12 : ил
https://www.ester.ee/record=b1356516*est

Исследование прямой ветви вольтамперной характеристики эпитаксиальных и диффузионных электросварочных диодов
Vaher, G.; **Velmre, Enn**; Mäe, T.; **Freidin, Boris** Силовые полупроводниковые приборы : сборник статей 1981 / с. 7-15 : ил
https://www.ester.ee/record=b1264428*est

Исследование статических и динамических характеристик транзисторных широтно-импульсных стабилизаторов постоянного напряжения : автореферат ... кандидата технических наук (05.253)
Velmre, Enn 1970 https://www.ester.ee/record=b1522330*est

Исследование устойчивости установившегося режима в системе с широтно-импульсной модуляцией второго рода
Velmre, Enn Труды по электротехнике и автоматике : сборник статей. 12 1974 / с. 51-62 : ил
https://www.ester.ee/record=b2190668*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/57b94a1f-6879-4443-b6f2-322fd7e53d89

Исследование эффективности численных алгоритмов моделирования силовых полупроводниковых структур в проводящем состоянии
Velmre, Enn; **Udal, Andres**; **Freidin, Boris** Электронное моделирование = Electronic modeling : международный научно-теоретический журнал 1981 / с. 85-88 https://www.ester.ee/record=b1291241*est

К вопросу об эффективной длине диффузии носителей заряда в условиях перепоглощения рекомбинационного излучения
Velmre, Enn Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции "Современные методы и устройства радиоэлектронного оборудования", посвященной Дню радио. Секция: полупроводниковые приборы 1981 / с. 32-33
https://www.ester.ee/record=b1310801*est

К расчету максимального напряжения переключения p-n-p-n-структуры

Velmre, Enn; **Rang, Toomas** Анализ и моделирование технических устройств и систем АСУТП 1977 / с. 121-126 : ил https://www.ester.ee/record=b2190987*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b7c66054-0b4f-4684-9453-442bc7e6e200

К расчету некоторых параметров процесса лавинного размножения носителей в резких кремниевых p-n-переходах
Vaher, G.; **Velmre, Enn** Применение эпитаксиальной технологии в производстве силовых полупроводниковых приборов : сборник материалов Всесоюзного научно-технического семинара. Часть 1 1978 / с. 89-96 https://www.ester.ee/record=b1273235*est

К расчету отпирающего тока управления p-n-p-n-структуры
Nurste, Ivar; **Velmre, Enn** Анализ и моделирование технических устройств и систем АСУТП 1977 / с. 127-133 : ил https://www.ester.ee/record=b2190987*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b7c66054-0b4f-4684-9453-442bc7e6e200

Лавинное размножение носителей в кремниевых арсенид-галлиевых и фосфидиндиевых дополнительных PN-переходах
Rang, Toomas; **Velmre, Enn** Расчет и проектирование систем технической кибернетики 1984 / с. 3-13

Лавинное размножение носителей заряда в дополнительных p-n-переходах
Velmre, Enn Расчет и проектирование приборов, устройств и систем технической кибернетики 1981 / с. 3-14 : ил https://www.ester.ee/record=b1319172*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/4c9b1559-97b9-4d9b-bac8-6c40840ba442

Моделирование технологического процесса кремниевых силовых полупроводниковых приборов на ЭВМ
Rang, Toomas; **Velmre, Enn** Синтез и диагностика цифровых устройств и систем 1982 / с. 107-112 : ил https://www.ester.ee/record=b1328194*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/febd586e-d7fa-4fbd-bf41-40576a75f94b

Неизотермическая динамическая прямая ветвь вольт-амперной характеристики силовых арсенид-галлиевых диодов
Aškinazi, German; **Velmre, Enn**; Logussov, A.; Timofejev, V.; **Freidin, Boris**; Šumilin, V. Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Füüsika. Matemaatika = Известия Академии наук Эстонской ССР. Физика. Математика = Proceedings of Academy of Sciences of the Estonian SSR. Physics. Mathematics 1984 / с. 48-56 : ил https://www.ester.ee/record=b1264310*est

О влиянии Оже-рекомбинации на прямую ветвь вольтамперной характеристики силового полупроводникого диода
Velmre, Enn; Dorodnev, V. Труды по электротехнике и автоматике : сборник статей. 13 1975 / с. 85-91 : ил https://www.ester.ee/record=b2190710*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/ffbd63ed-06d6-4bbb-9468-118f743cc87f

О влиянии электронно-упрочного рассеяния на коэффициент передачи лико микроэлектронного биполярного транзистора
Velmre, Enn; **Udal, Andres** Математическое моделирование физических процессов в полупроводниках и полупроводниковых приборах : тезисы докладов II всесоюзного совещания (г. Ярославль, сентябрь 1988 г.) 1988 / с. 40

О развитии научно-исследовательского направления "Приборы и устройства силовой полупроводниковой электроники"
Velmre, Enn Развитие научных исследований в области технических наук в Эстонской ССР : тезисы республиканской конференции : Таллин, 15-16 октября 1986 г 1986 / с. 136-139 https://www.ester.ee/record=b1231513*est

Обобщенные формулы для анализа лавинного умножения носителей заряда в pn-переходах
Velmre, Enn Automation, simulation & measurement : 3rd biennal conference : Tallinn, Estonia, October 7-11, 1991. Section S, Simulation = Automatiseerimine, modelleerimine ja mõõtmine : 3. rahvusvaheline konverents / Tallinna Tehnikaülikool 1992 / с. 172-183: ил https://www.ester.ee/record=b1064031*est

Определение параметров рекомбинационных центров из измерений волть-амперных характеристик p-n-перехода
Velmre, Enn Тезисы докладов республиканской научно-технической конференции, посвященной 80-летию со дня изобретения радио А. С. Поповым 1975 / с. 8 https://www.ester.ee/record=b1322122*est

Приближенный метод исследования переноса неравновесных носителей заряда в варизонных полупроводниках с учетом перепоглощения рекомбинационного излучения
Velmre, Enn Полупроводники и гетеропереходы : сборник статей 1987 / с. 12-14 https://www.ester.ee/record=b1262177*est

Приближенный расчет коэффициента переноса носителей заряда в условиях перепоглощения межзонного рекомбинационного излучения
Velmre, Enn Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Füüsika. Matemaatika = Известия Академии наук Эстонской ССР. Физика. Математика = Proceedings of Academy of Sciences of the Estonian SSR. Physics. Mathematics 1984 / lk. 87-94 https://www.ester.ee/record=b1264310*est

Применение интерполяционных кубических сплайнов при решении уравнения диффузии с учетом перепоглощения межзонного рекомбинационного излучения
Velmre, Enn Расчет и проектирование измерительных преобразователей 1983 / с. 51-55
https://www.ester.ee/record=b1288985*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/4e3815a3-f217-4ae2-9776-1b5ea3c25959

Применение численных моделей для усовершенствования технологии производства силовых полупроводниковых приборов
Velmre, Enn; **Udal, Andres**; **Freidin, Boris** Системы автоматизированного проектирования изделий микроэлектроники, новые методы и технологии микроминиатюрных элементов : сборник докладов постоянно действующего семинара "Современная технология производства приборов, средств автоматизации и систем управления" 1981 / с. 51-56

Применение численных моделей при разработке полупроводниковых приборов и технологии их изготовления
Velmre, Enn; **Udal, Andres**; **Freidin, Boris** Системы автоматизированного проектирования изделий микроэлектроники, новые методы и технологии микроминиатюрных элементов : Сборник докладов постоянно действующего семинара "Современная технология производства приборов, средств автоматизации и систем управления" 1981 / с. 51-56

Прогнозирование величины ударного тока при одномерном численном моделировании силовых полупроводниковых структур
Velmre, Enn; **Nurste, Ivar** Численные методы и средства проектирования и испытания элементов твердотельной электроники : тезисы докладов республиканского совещания. Том I = Tahkekeha elektroonika elementide projekteerimise ja katsetamise numbrilised meetodid ja vahendid : Vabariikliku nõupidamise ettekannete teesid. Köide I 1989 / с. 157-160 : ил
https://www.ester.ee/record=b1272248*est

Программа "Динамит-1" для одномерного численного моделирования тиристорных структур
Velmre, Enn; **Udal, Andres** Силовые полупроводниковые приборы : сборник статей 1986 / с. 59-63 : ил
https://www.ester.ee/record=b1591355*est

Расчет коэффициента лавинного размножения резких кремниевых p-n-переходов
Velmre, Enn Acta polytechnica. řada 4, Technicko-teoreticka = Acta polytechnica. serija 4, Teoretičeskaja = Acta polytechnica. series 4, Theoretical studies = Acta polytechnica. Reihe 4, Theoretische Reihe = Acta polytechnica. série 4, Théorique 1975 / с. 117-122

Расчет коэффициента переноса неосновных носителей заряда в условиях перепоглощения межзонного рекомбинационного излучения
Velmre, Enn Полупроводниковые гетеропереходы : тезисы докладов II республиканской конференции, Эльва, 24-26 ноября 1982 г 1982 / с. 25 https://www.ester.ee/record=b1304403*est

Расчет коэффициентов лавинного размножения в резких кремниевых p-n переходах
Vaher, G.; **Velmre, Enn** Тезисы докладов республиканской научно-технической конференции, посвященной Дню радио, Таллин, 1977 1977 / с. 49 https://www.ester.ee/record=b1313776*est

Расчет показателя степени в формуле Миллера
Velmre, Enn Труды по электротехнике и автоматике : сборник статей. 11 1973 / с. 145-154 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190624*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d6e57925-e104-44e1-a218-c5b3110d9996

Сравнение статических параметров диодных структур из GaAs и InP
Velmre, Enn; **Nurste, Ivar**; **Freidin, Boris** Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции "Современные методы и устройства радиоэлектронного оборудования", посвященной Дню радио. Секция: полупроводниковые приборы 1981 / с. 30-31 https://www.ester.ee/record=b1310801*est

Физические аспекты учета влияния эффекта электронно-дырочного рассеяния при математическом моделировании полупроводниковых структур
Velmre, Enn Машинное проектирование электронных устройств и систем 1988 / с. 166-174 : ил

Численное моделирование напряженности электрического поля и напряжения пробоя в полупроводниковой структуре с двойной фаской
Velmre, Enn; Kuusik, E.; **Tergem, Ilmar** Силовые полупроводниковые приборы : сборник статей 1981 / с. 50-58 : ил
https://www.ester.ee/record=b1264428*est

Численное моделирование неизотермических переходных процессов в арсенид-галлиевых диодных структурах
Velmre, Enn; **Freidin, Boris** Известия высших учебных заведений : международный ежемесячный научно-технический журнал. Радиоэлектроника 1984 / с. 86-88 https://www.ester.ee/record=b2768571*est

Численное моделирование неизотермических переходных процессов в силовых полупроводниковых приборах при большой плотности прямого тока
Velmre, Enn; **Nurste, Ivar**; **Freidin, Boris** Известия высших учебных заведений : международный ежемесячный научно-технический журнал. Радиоэлектроника 1989 / с. 80-82 https://www.ester.ee/record=b2768571*est

Численное моделирование неизотермических переходных процессов в силовых полупроводниковых приборах при воздействии мощного импульса прямого тока
Velmre, Enn; **Freidin, Boris** Электронное моделирование = Electronic modeling : международный научно-теоретический журнал 1983 / с . 73-76 https://www.ester.ee/record=b1291241*est

Численное моделирование переходных процессов в арсенид-галлиевых диодных структурах
Velmre, Enn; **Freidin, Boris** Известия высших учебных заведений : международный ежемесячный научно-технический журнал. Радиоэлектроника 1983 / с. 93-95 https://www.ester.ee/record=b2768571*est

Численное моделирование процесса выключения одномерных кремниевых тиристорных структур
Velmre, Enn; **Udal, Andres** Полупроводниковые приборы : сборник статей 1982 / с. 74-79 : ил
https://www.ester.ee/record=b1356516*est

Численное моделирование процессов в полупроводниковых структурах с учетом рекомбинации через многозарядные центры
Velmre, Enn; **Opotski, Aleksei**; **Udal, Andres** Численные методы и средства проектирования и испытания элементов РЭА : тезисы докладов. Том 1 1987 / с. 131-134 : ил https://www.ester.ee/record=b1273986*est

Численное моделирование процессов включения и выключения диодной структуры на основе прямозонного полупроводника
Velmre, Enn; **Freidin, Boris** Силовые быстродействующие полупроводниковые приборы : сборник статей / Научно-исследовательский институт Производственного объединения" Таллиннский электротехнический завод им. М. И. Калинина" 1984 / с. 90-94 : ил https://www.ester.ee/record=b1238033*est http://www.digar.ee/id/nlib-digar:887842

Численное моделирование силовых полупроводниковых приборов
Velmre, Enn Измерение и моделирование в электронике 1987 / с. 49-64

Численное моделирование статических неизотермических процессов в кремниевых силовых диодных и тиристорных структурах в открытом состоянии
Velmre, Enn; **Udal, Andres**; **Freidin, Boris** Всесоюзный научно-технический семинар "Повышение параметров силовых полупроводниковых приборов на основе новых конструктивных решений и методов изготовления" (Запорожье, 1981) 1981 / с.37-38

Численное моделирование температурных распределений в кремниевых силовых полупроводниковых приборах при воздействии мощного импульса прямого тока
Velmre, Enn; **Nurste, Ivar**; **Freidin, Boris** Проблемы моделирования полупроводниковых структур и сложных схем на ЭВМ 1982 / с. 49-58 : ил https://www.ester.ee/record=b1339926*est https://www.etera.ee/zoom/121726/view?page=3&p=separate&search=true&tool=search

Численное моделирование тиристора, управляемого полем
Velmre, Enn; **Piroženko, Aleksander** Численные методы и средства проектирования и испытания элементов твердотельной электроники : тезисы докладов республиканского совещания. Том I = Tahkekeha elektroonika elementide projekteerimise ja katsetamise numbrilised meetodid ja vahendid : Vabariikliku nõupidamise ettekannete teesid. Köide I 1989 / с. 153-156 : ил
https://www.ester.ee/record=b1272248*est

Численное моделирование ударного режима кремниевых тиристоров
Velmre, Enn; **Nurste, Ivar**; **Freidin, Boriss** Измерение и моделирование в электронике 1987 / с. 78-88 : ил

Численное моделирование ударного режима силовых полупроводниковых приборов с учетом электронно-дырочного рассеяния
Velmre, Enn; **Nurste, Ivar**; **Freidin, Boris** Численные методы и средства проектирования и испытания элементов РЭА : тезисы докладов. Том 1 1987 / с. 143-145 : ил https://www.ester.ee/record=b1273986*est

Численное моделирование физических процессов в одномерных кремниевых диодных структурах в стационарном режиме
Velmre, Enn; **Freidin, Boris**; **Udal, Andres** Алгоритмы и программы : информационный бюллетень 1980 / с. 88

Численное моделирование физических процессов в прямосмещенных структурах на основе прямозонных полупроводников
Velmre, Enn; **Freidin, Boris** Полупроводниковые приборы : сборник статей 1982 / с. 25-31 : ил
https://www.ester.ee/record=b1356516*est

Численное моделирование эксперимента Шокли-Хейнса
Velmre, Enn; **Udal, Andres** Силовые полупроводниковые приборы : сборник статей 1986 / с. 49-53 : ил
https://www.ester.ee/record=b1591355*est

Численное моделирование электротепловых процессов в силовых полупроводниковых приборах с учетом электронно-дырочного рассеяния
Velmre, Enn; **Nurste, Ivar**; Seleninov, Kazimir; **Freidin, Boris** Силовые быстродействующие полупроводниковые приборы : сборник статей. Часть II 1989 / с. 185-188 https://www.ester.ee/record=b1264433*est

Численное моделирование электрофизических процессов в полупроводниках с учетон электронно-дырочного рассеяния
Velmre, Enn; **Piroženko, Aleksander**; **Udal, Andres** Электронное моделирование = Electronic modeling : международный научно-теоретический журнал 1985 / с. 66-71 https://www.ester.ee/record=b1291241*est

Численный анализ неизотермических переходных процессов в арсенидгаллиевых диодных структурах
Aškinazi, German; **Velmre, Enn**; Kivi, U.; Timofejev, V.; **Freidin, Boris**; Šumilin, V. Полупроводниковые гетеропереходы : тезисы докладов II республиканской конференции, Эльва 24-26 ноября 1982 г. 1982 / с. 15 https://www.ester.ee/record=b1304403*est

Численный анализ одномерных полупроводниковых структур в стационарном режиме
Velmre, Enn; **Freidin, Boris** Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции, посвященной дню радио и деятельности Эстонской организации НТОРЭС им. А. С. Попова за годы 1958-1978 1978 / с.32
https://www.ester.ee/record=b1314631*est

Численный анализ переходных процессов в диодных структурах на основе прямозонных полупроводников
Velmre, Enn; **Freidin, Boris** Полупроводниковые гетеропереходы : тезисы докладов II республиканской конференции, Эльва 24-26 ноября 1982 г. 1982 / с. 26 https://www.ester.ee/record=b1304403*est

Численный расчет диода с точным учётом электронно-дырочного рассеяния
Velmre, Enn; **Udal, Andres** Силовые быстродействующие полупроводниковые приборы : сборник статей 1984 / с. 39-43
https://www.ester.ee/record=b1238033*est

Электротехника и автоматика
Mägi, Harri; **Velmre, Enn**; **Pikkov, Mihhail**; Orro, S.; **Rang, Toomas**; **Gurjanov, Boris**; **Kruus, Margus**; **Salum, Kaja**; **Berkman, Boriss**; **Keevallik, Andres**; **Kasirova, Lilia**; **Kruus, Margus**; **Ellervee, Peeter**; **Ubar, Raimund-Johannes**; **Grigorjeva, Ksenja**; **Kont, Toomas** 1989 https://www.ester.ee/record=b1285446*est

Электротехника и автоматика
Ubar, Raimund-Johannes; **Rang, Toomas**; **Velmre, Enn**; **Evartson, Teet**; Voolaine, A.; **Toome, Tõnis**; **Viilup, Agu**; **Sudnitsõn, Aleksander**; **Berkman, Boriss**; **Rüstern, Ennu**; **Leis, Paul**; **Keevallik, Andres**; **Kruus, Margus**; Jüris, A. 1984
https://www.ester.ee/record=b1549179*est

Электротехника и автоматика
Kukk, Vello; **Tamm, Uljas**; **Pikkov, Otto**; **Min, Mart**; **Velmre, Enn**; **Udal, Andres**; **Nurste, Ivar**; **Freidin, Boris**; **Rang, Toomas**; **Opotski, Aleksei**; **Laansoo, Ants**; **Männama, Vello**; **Järvalt, Aldur**; **Gurjanov, Boris**; **Lavrov, Mihhail**; Belkina, I.I.; **Plakk, Paul**; **Plakk, Peeter**; Plakk, T. 1987 https://www.ester.ee/record=b1224910*est

Электротехника и автоматика
Rüstern, Ennu; **Keevallik, Andres**; **Kruus, Margus**; **Salum, Kaja**; **Berkman, Boriss**; **Tammemäe, Kalle**; **Alango, Villem**; **Kont, Toomas**; **Ubar, Raimund-Johannes**; Lohuaru, Tõnu; Štraube, B.; Elst, G.; Bombik, B.; **Viies, Vladimir**; Gallai, S.; **Rang, Toomas**; **Laansoo, Ants**; **Männama, Vello**; **Pikkov, Otto**; **Gurjanov, Boris**; **Opotski, Aleksei**; **Velmre, Enn** 1988
https://www.ester.ee/record=b1256708*est